5.4 增益型和异质结半导体光电探测器

增加PN-PD耗尽层I的宽度

PIN-PD,但光生电流仍然微踢

多次放大

光生电流在光电探测器内部放大

噪声放大、引入放大器噪声

增益型半导体光电探测器

S/N下降

雪崩光电二极管 (APD)

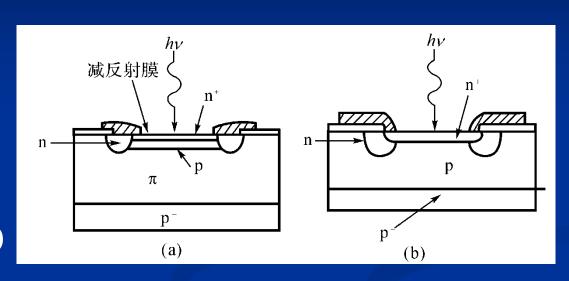
光晶体管

结构改进

异质结雪崩光电二极管、异质结光晶体管

5.4.1 雪崩光电二极管 (APD)

PN-PD 高反偏压 碰撞离化 雪崩光电效应 雪崩光电人数管 (APD)



- 内部电流增益, 灵敏度高
- •响应速度快,可达1000 GHz,即1 THz

1. 雪崩倍增因子M

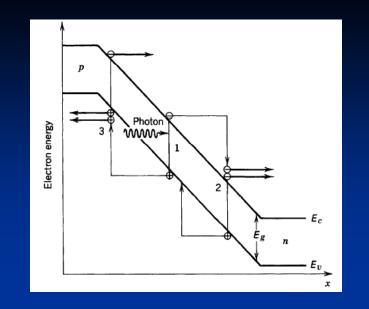
雪崩倍增过程是复杂的随机过程:

每一个初始光生电子—空穴对的

•产生位置

随机

• 碰撞离化位置



•激发二次电子—空穴对的数目都是随机的

电子(空穴)电离率 $\alpha_n(\alpha_p)$:

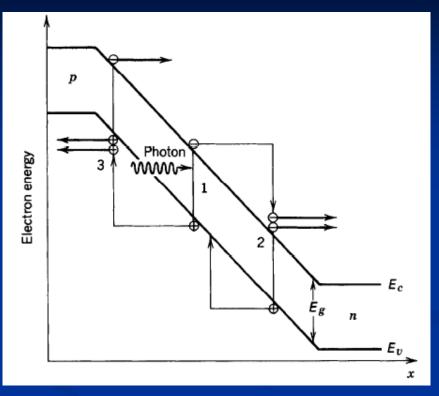
一个电子(空穴)在单位距离上激发一个二次电子—空穴对的概率,是电场的强相关函数。

材料的电子—空穴电离率比:

$$K = \alpha_{\rm n}/\alpha_{\rm p}$$

如果电子和空穴有相同的电离化率 (K=1),雪崩过程不断重复,不会停止:

- 增大器件增益;
- 耗时长,减小器件带宽:
- 随机过程,增大器件噪声;
- 不稳定会导致雪崩击穿。图5.4.3



APD器件的稳定工作要求仅有一种载流子能引起碰撞电离(K=0或 ∞)。硅材料的电子的电离率远大于空穴,故雪崩过程主要从左向右进行。

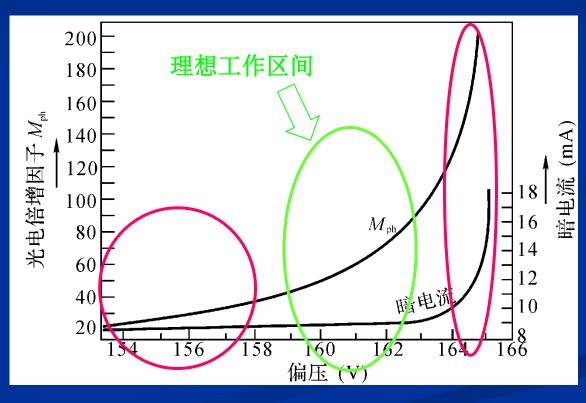
电场增加,导致电离率 α_n 上升、 α_p 上升,雪崩增益上升 雪崩倍增因子multiplication factor: M

$$M = J/J_0 = (J_{\rm ph} + J_{\rm D})/(J_{\rm pho} + J_{\rm Do})$$

光电倍增因子 $M_{\rm ph}$

$$M_{
m ph} = J_{
m ph}/J_{
m pho}$$

电离率比 $K = \alpha_n/\alpha_n$



2. 增益带宽积f_T

雪崩倍增因子M增加

雪崩平均渡越次数m增加

雪崩区时间常数tm增加

响应时间增加、响应速度下降

带宽下降

增益与带宽互相制约

gain-bandwidth product

增益带宽积 $f_T = M \cdot B$

增益带宽积 $f_T = M \cdot B$



 $f_{\rm T} = (K \cdot v_{\rm S})/[N(K) \cdot W]$:

- •雪崩区宽度减少,导致 f_{T} 增加
- •饱和漂移速度上升,导致 f_{T} 增加
- 电离率比上升,导致 f_{Γ} 增加
- N(K) 随K的慢变函数



电离率比K上升,导致 f_T 增加



选用高电离率比的材料

3. 过剩噪声因子noise factor: F

理想的倍增过程:

- •通过倍增区的每个电子或空穴都倍增M倍
- ·光跃迁随机引起散粒噪声电流也相应倍增M倍
- •散粒噪声均方电流增加了100倍

$$< i_s^2 > = 2e(I_{ph} + I_b + I_D)BM^2$$

实际的雪崩倍增:

- •载流子个体倍增g,随机雪崩过程导致电流平均倍增 $M=\langle g \rangle$ 。
- •由于雪崩过程中碰撞电离的随机性,会引起附加的噪声,称为雪崩噪声或过剩噪声。

$$< i_s^2 > = 2e(I_{ph} + I_b + I_D)B < g^2 >$$

• $< g^2 > = F(M)M^2$, F(M): 过剩噪声因子

过剩噪声因子F(M)



雪崩倍增导致噪声倍增比信号倍增更强:

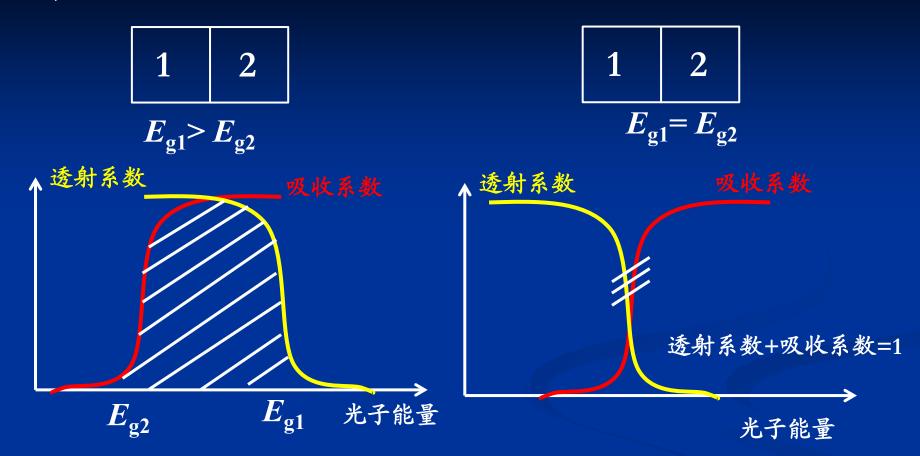
$$F(M) = M^{\chi}$$
 $< g^2 > = M^{2+\chi}$
过剩噪声指数 χ

 χ 一般在0.3~1范围内,对于硅的APD, χ =0.3~0.5; 对于锗的APD, χ =0.8~1。选取APD时应该选择 χ 比较小的管子。

5.4.2 异质结的窗口效应、光限制作用、光电二极管

光照射异质结宽带区 E_{g2} 高能光子 $hv \leq E_{g1}$ $E_{g1} < hv < E_{g2}$ 光子透过宽带材料 宽带区产生电子—空穴对 进入窄带材料 光子不能进入窄带材料 不能扩散到耗尽区 在窄带区产生 电子—空穴对 在窄带区不能产生电子—空穴对 产生光电流 无光电流

窗口效应



构成异质结PD:

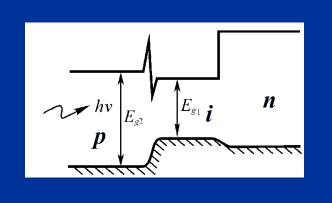
- 缺点: 晶格常数不匹配, 暗电流较大
- 优点:量子效率提高、响应速度上升、选择响应窗口

任何事情都不是绝对的!

能量大于 E_{g2} 的光

宽带区宽度相当薄,并进一步下降被宽带材料吸收,产生电子-空穴对

透过宽带层被窄带材料吸收,产生电子-空穴对



扩散到结区,进入窄带材料

光电流

突破异质结窗口效应的限制, 光响应延伸到短波较远的区域:

- 异质结的"窗口"效应: $1.24/E_{\rm g2} < \lambda < 1.24/E_{\rm g1}$
- · 薄宽带区光响应延伸: λ<1.24/E_{g2}

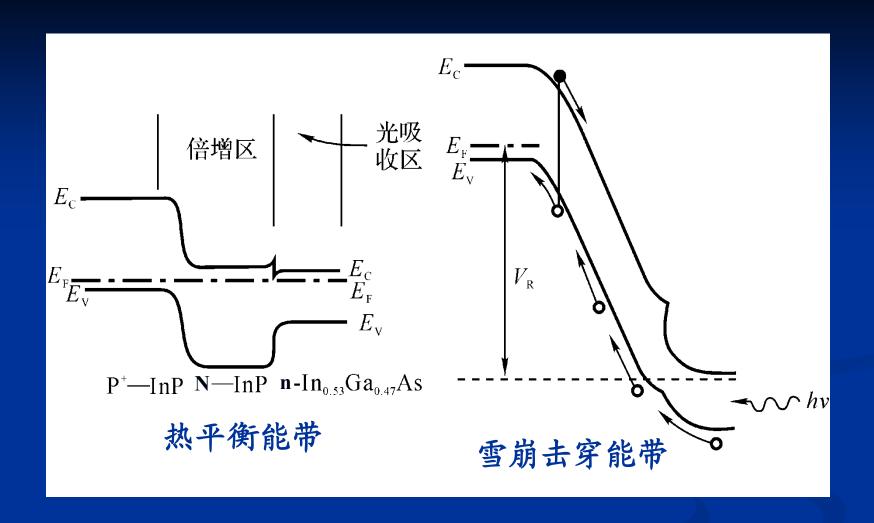
5.4.3 异质结雪崩光电二极管

异质结雪崩光电二极管优点(与Si或Ge-APD比较):

- 波长可调谐
- 暗电流低
- 量子效率高
- 响应速度快

工艺要求:

- 降低隧道电流
- 减少异质结界面处电荷积聚
- 制作保护环层



InGaAs/InP异质结APD的能带结构

材料A: Al_{0.45}Ga_{0.55}As:

厚度55 nm、电子和空穴电离率比值 $K = \alpha_{\rm n}/\alpha_{\rm p} \approx 1$

材料B: GaAs:

厚度45 nm、电子和空穴电离率比值K≈1



异质结: $\Delta E_{\rm C} = 0.45 \text{ eV}$ 、 $\Delta E_{\rm V} = 0.08 \text{ eV}$

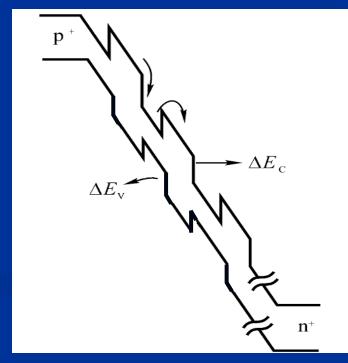


周期性异质结(25):

电子自由程约为50 nm



超晶格结构



超晶格结构:

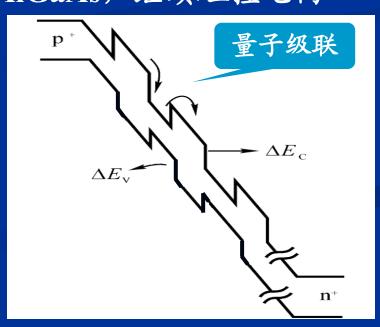
- · AlGaAs中光激发的电子空穴对,碰撞电离产生电子空穴对
- $\Delta E_{\rm C}$ = 0.45 eV较大
 - 倍增电子进入GaAs层,能量比导带底高 ΔE_{C}
 - 热电子碰撞电离, 电离率很大



• $\Delta E_{\rm V}$ = 0.08 eV很小:

附加能量很小,效应不显著

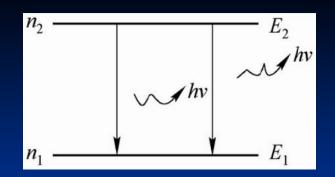
超晶格结构的K≥10,作为 雪崩光电二极管的耗尽区约2500 nm



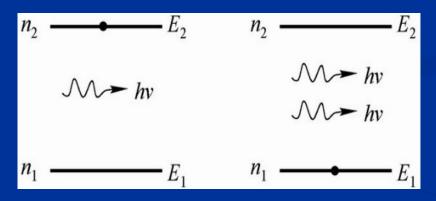
5.6 发光二极管(LED)

正向偏置pn结 (电子或空穴) 正向注入 (空穴或电子) 复合 自发辐射发光 发光二极管(LED):

- 紫外光
- 可见光: 电光源(显示、照明)
- 红外光: 通信(0.85 μm、1.31 μm、1.55 μm)



- 自发辐射: 无外电磁场作用时,电子自发从高能级向低能级跃迁,并发射光子。
- 自发辐射场的传输方向、偏振、相位等都是无规则随机分布的,非相干。



- 受激辐射: 当收到外来能量E=ħv=E₁-E₂的光照射时,高能级的电子受外来光的激励作用向低能级跃迁,同时发射一个与外来光子完全相同的光子。
- 受激辐射的光子与外来光子特性完全相同:频率、相位、偏振和传播方向 完全一样,即受激辐射与外来辐射是相干的,外来辐射被"放大"了。

5.6.1 发光效率与量子效率

二极管正向偏置电流密度有:

少子电子扩散电流密度:

少子空穴扩散电流密度:

空间电荷复合电流密度:

$$J_{\rm n} = \frac{eD_{\rm n}n_{\rm p0}}{L_{\rm n}} \left[\exp\left(\frac{eV}{k_{\rm B}T}\right) - 1 \right]$$

$$J_{p} = \frac{eD_{p}p_{n0}}{L_{p}} exp\left(\frac{eV}{k_{B}T}\right) - 1$$

$$J_{R} = \frac{en_{1}W}{2\tau_{0}} \left| \exp \left(\frac{eV}{2k_{B}T} \right) - 1 \right|$$

GaAs发光主要由少子电子复合产生

$$\gamma = \frac{J_{\text{n}}}{J_{\text{n}} + J_{\text{p}} + J_{\text{R}}}$$

少子扩散电流百分比: $\gamma = \frac{1}{J_n + J_p + J_R}$ pn^+ -GaAs二极管的 J_p 、 J_R 都相对很小 h



辐射效率radiative efficiency:
$$\eta = \frac{\tau_{nr}}{\tau_{nr} + \tau_{r}}$$
 非辐射寿命

Internal quantum efficiency内量子效率η」:

ημ=γη=单位时间产生光子数/单位时间注入电子-空穴对数

external quantum efficiency外量子效率 η分:

η分=单位时间从晶体发射出的光子数/单位时间注入的电子-空穴

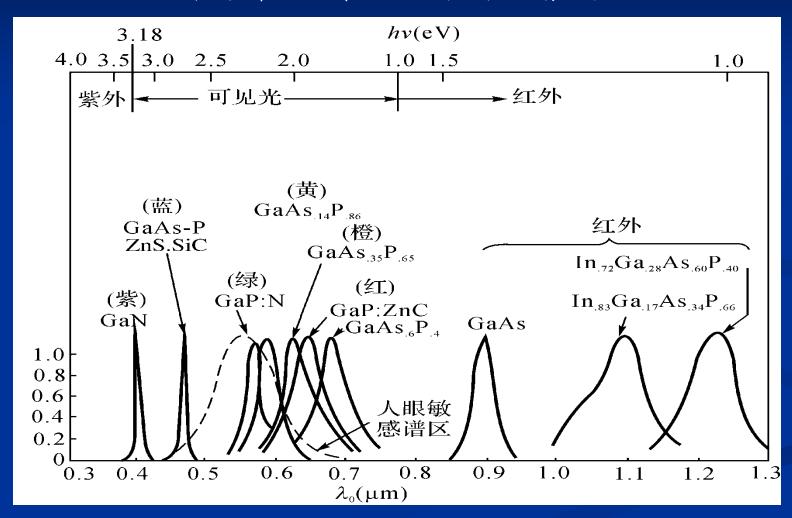
$\eta_{\phi} < \eta_{\phi}$

单位时间从晶体发射出的光子数<单位时间产生的光子数:

- · 体内光吸收 hv>E。
- 菲涅耳(反射)损耗
- 临界角(全反射)损耗

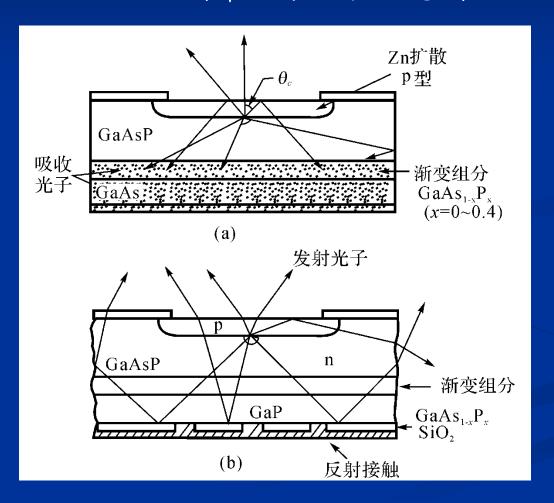
5.6.2 LED材料

几种材料LED在室温下的光谱响应:



5.6.3 LED的结构和性能

LED结构中光子吸收示意图:



5.7 半导体激光器(LD)

激光: 辐射受激发射的光放大

ight amplification by Stimulated Emission of radiation 激光器种类(按工作物质分):

- 固体激光器
 - 半导体激光器 —————(连续)能带跃迁
 - 一般固体激光器
- 液体激光器
- 气体激光器
- 其它激光器(自由电子、高温等离子体))

能级跃迁

上海超强超短激光实验装置(SULF)



10拍瓦=1016瓦=5000×全球电网平均功率

半导体激光器的特点:

- (连续)能带跃迁
- 方向性较差
- 空间和时间特性受材料特性的影响较大.
- 体积小、重量轻、抗震性强
- 结构简单
- 通过调制电流来调制激光的发射
- 高频调制特性好
- · 可以产生0.85 μm、1.31 μm、1.55 μm附近的激光



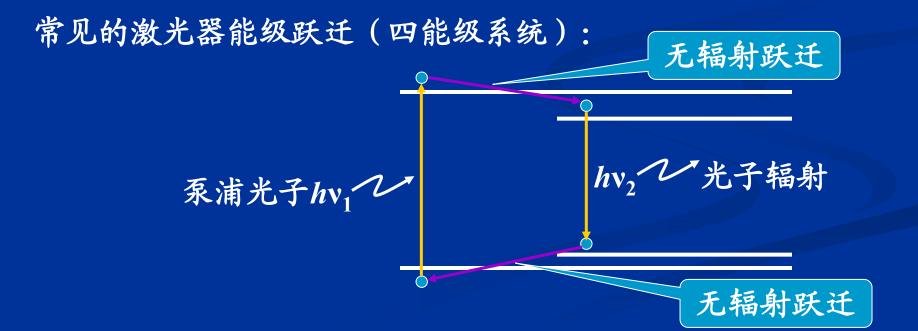
光纤通信的光源与探测器

- 波长0.85 μm:
 - 光源: GaAs-Al, Ga_{1-v}As异质结LD、...
 - 探测器: Si-PIN、Si-APD、...
- 波长1.31 μm、1.55 μm:
 - 光源: Ga_xIn_{1-x}As_vP_{1-v}、Ga_{.47}In_{.53}As LD
 - 探测器: Ge、Ga_{.47}In_{.53}As、..., PIN、APD

5.7.1 半导体受激光发射的产生

激光器三要素:

- 粒子数分布反转population inversion(区域: 有源区)
- 谐振腔(产生单色性和方向性都很好的单色光)
- 國值条件(泵浦:提供能量获得增益,抵消内部损耗、 产生激光输出)



半导体激光器泵浦(产生粒子数反转):

- 光激励
- 电子束激励
- •雪崩碰撞激励
- ·pn结正向注入激励 (☆



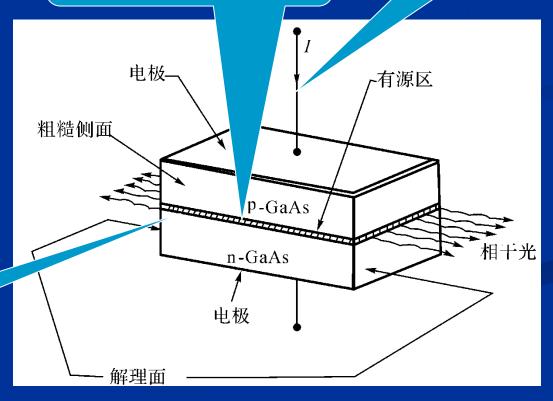
粒子数分布反转



半导体的解理面:

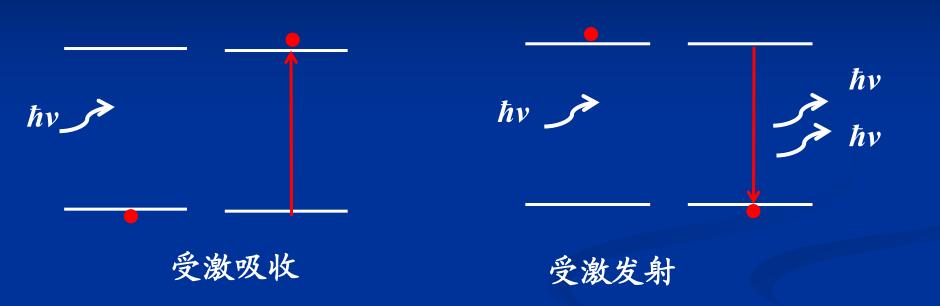
- 晶面间距最大
- 结合最弱
- 最易断裂

解理面作为反射镜, 形成谐振腔



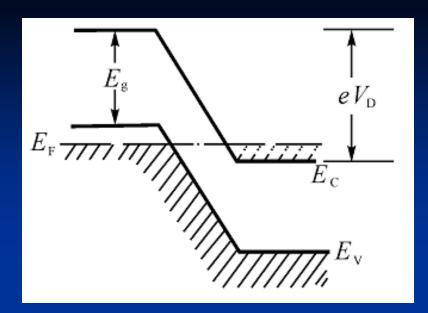


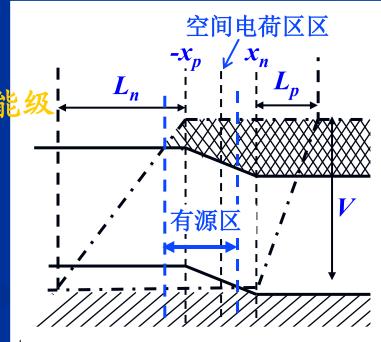
1. 粒子数分布反转



- 受激发射概率=受激吸收概率;
- 哪一种过程起主导取决于粒子分布情况;
- 处于激发态原子数大于基态原子数,受激发射将超过吸收(光增益);

- 1. 粒子数分布反转 pn结
 - 简并化高掺杂
- V_D很大,使
- ·n型区费米能级进入导带
- · p型区费米能级进入价带
- pn结正向偏置,注入载流子
- 费米能级分裂成电子、空穴准费米能级
- ·大量电子从n区注入到结区
- ·大量空穴从p区注入到结区
- 高浓度的非平衡载流子





准费米能级quasi-Fermi energy level: 描述非平衡载流子在能带内分布状态的参考能级,表示单个主带中载流子处于热平衡状态,但电子与空穴之间不处于统一的热平衡状态

高浓度的非平衡载流子



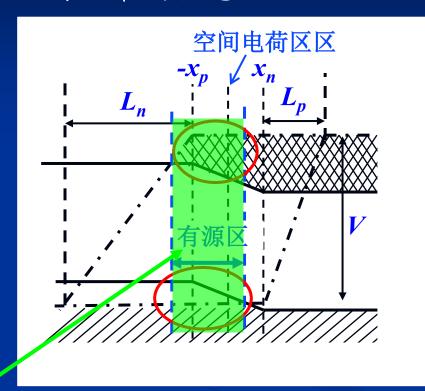
- 粒子数分布反转
- 偏离热平衡状态



结区及附近部分区域出现有源区

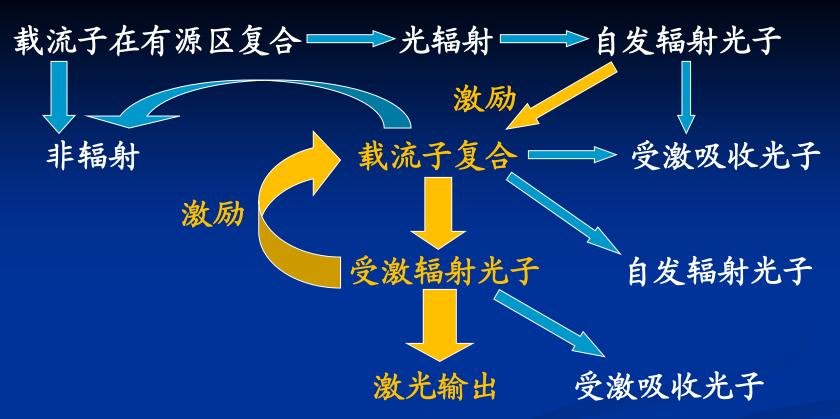
电子的扩散长度比空穴的大

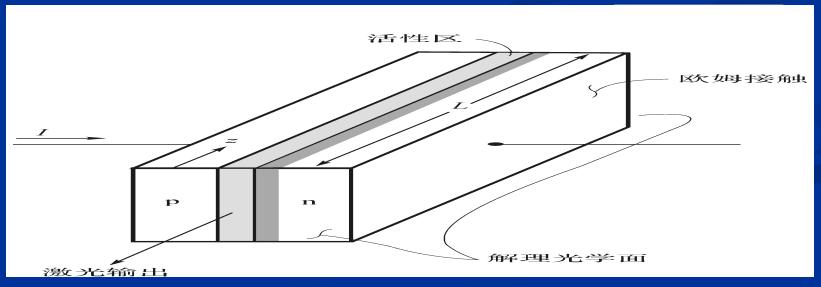
有源区偏离结区移向p区



粒子数分布反转(有源区):

- 导带底部有较多电子
- 价带顶底部有一些空穴 载流子在有源区复合





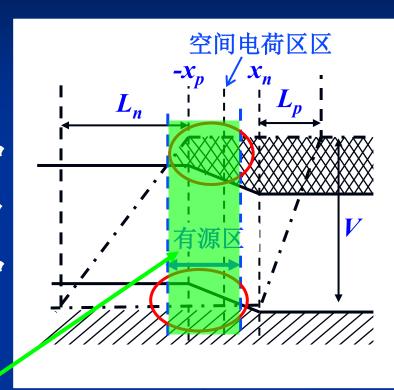
受激辐射产生的激光,具有相同的频率、相关的相位

pn结



- •电子准费米能级 E_F n在n型区导带中 并延伸到p型区导带中
- 空穴准费米能级 E_{F} $^{\mathrm{p}}$ 在 p 型区价带中

$$E_{\rm F}^{\rm n} - E_{\rm F}^{\rm p} = eV > h \nu > E_{\rm gp}$$



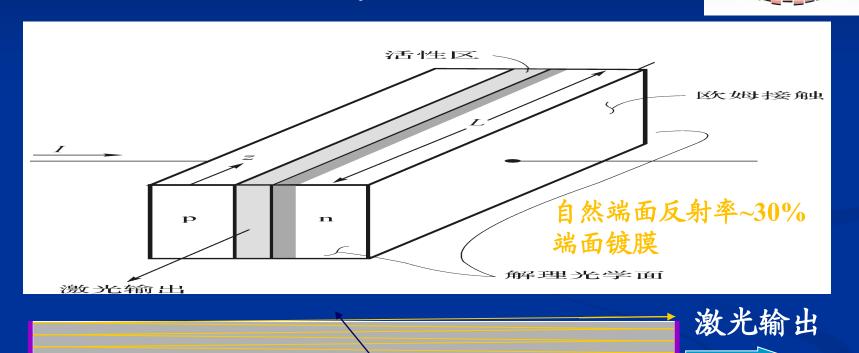
频率不单一

在有源区内, 粒子数分布反转

2. 光学谐振腔

GaAs-pn结激光器,以严格垂直结面方向的一对(110)解理面作为镜面构成平面谐振腔

常用法布里——珀罗(Fabry-Perot)谐振腔:

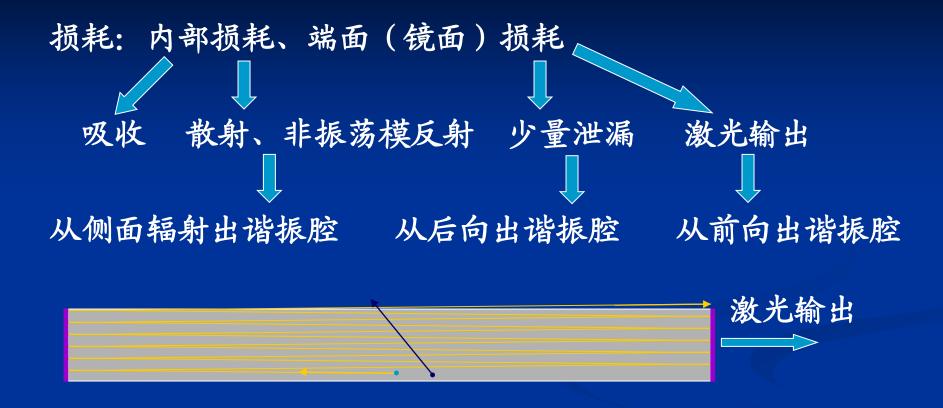


反射率R₁ (如100%) 长度1>>横向线度

反射率 R_2

(如98%)

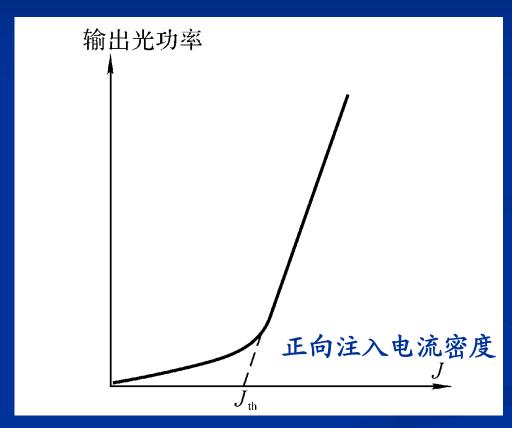
3. 阈值条件



- · 增益系数g: 光波沿z向传播单位长度内发射强度的增益
- 损耗系数α: 光波沿z向传播单位长度内发射强度的内部损耗
- 阈值条件:光波在谐振腔内往返传播一次的增益大于损耗

5.7.2 半导体激光器的主要特性

1. 半导体激光器输入输出关系



阈值电流密度

2. 阈值电流密度

谐振腔的振幅条件(阈值条件):

光波在谐振腔内往返传播一次的总增益为:

 $(R_1R_2) \exp(-\alpha \cdot 2l) \exp(g \cdot 2l) \ge 1$

镜面损耗

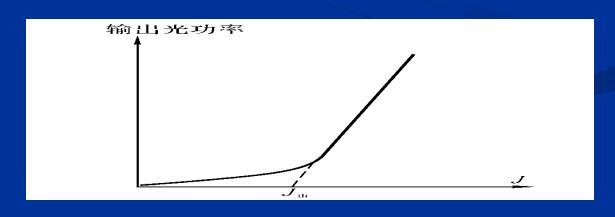
内部损耗

增益系数g>0损耗系数 $\alpha>0$ 增益

最低增益系数要求

阈值条件:

$$g \ge g_{\text{th}} = \alpha - \ln (R_1 R_2)/(2l) > \alpha$$



pn结二极管正向偏置 J增大,粒子 正向电流/较小/粒 J超过J_{th} J继续增加 数分布反转; 子数分布未能反转; 自发发射主导 受激发射主导 受激发射主导 激光功率急增 增益小于损耗 增益高于损耗 损耗>增益 超辐射 形成谱线敏锐的激光 输出光功率 无激光输出 无激光输出 •普通荧光 •较强荧光

正向注入电流密度

- 带宽较宽
- 类似LED
- •无震荡模式

• 理想半导体激光器(LD)阈值增益系数:

$$g_{\rm th} = \alpha - \ln (R_1 R_2)/(2l)$$

·实际LD阈值电流密度与阈值增益系数的关系(如GaAs):

$$g = \beta J^{\text{m}}$$

$$J_{\text{th}}^{\text{m}} = \frac{1}{\beta} \left[\alpha - \frac{\ln(R_1 R_2)}{2l} \right]$$

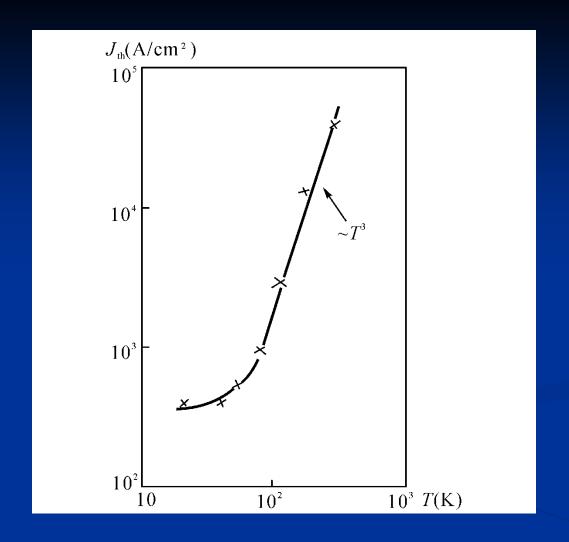


- m=1: GaAs同质结, $J_{th} \approx 4 \times 10^4 \text{ A/cm}^2$
- m = 2.8: 某GaAs/AlGaAs双异质结, $J_{th} \approx 10^3 \text{ A/cm}^2$



异质结的LD阈值电流密度Jth较小

阈值电流密度 大好? 小好?

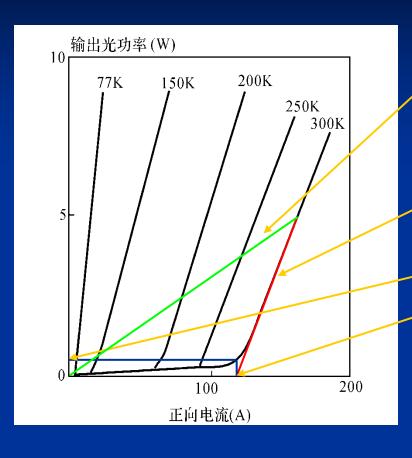


 $I_{\text{th}} = I_{\text{th0}} \exp(\Delta T/T_0)$, T_0 为特征温度



温度上升,激光输出下降

3. 输出光功率和转换效率



外量子效率:

$$\eta_{\beta} = P/(IV)$$

外微分量子效率:

$$\eta_{\mathrm{D}} = (P - P_{\mathrm{th}}) / [(I - I_{\mathrm{th}})V] \approx P / [(I - I_{\mathrm{th}})V]$$

某LD的外微分量子效率:ηD

77 K:
$$\eta_D = 50\%$$

300 K:
$$\eta_D = 30\%$$

 $J>J_{\text{th}}$, 外微分量子效率 η_{D} 与电流无关,与温度有关:

$$\eta_{\rm D} = f(T)$$

4. 模式与光谱分布



- •有源区长度(腔长)1、有源区宽度1x、有源区厚度1y
- 横向(x, y)边界反射,形成横向驻波(电磁场中的横模),两个横模指数: m、n
- ・沿谐振腔轴向镜面反射,形成纵向驻波(电磁场中的纵模), 纵模指数: q



稳定的场分布由模指数 (m, n, q) 表征

撰式是一种场分句

谐振腔的相位条件(纵模条件):

光波在谐振腔内往返传播一次,在

- · 有源介质中的相位变化为: k₀n2l
- 单镜面反射的相位变化为: 0或π
- 双镜面反射的相位变化为: 0或 2π

光波在谐振腔内往返传播一次的相位变化为:

$$\Delta \varphi = 2nlk_0 = 4\pi nl/\lambda_0 = 4\pi l/\lambda$$

相长干涉条件 $\Delta \varphi = 2\pi q$

- 真空中光波长: $\lambda_0 = 2nl/q$
- · 介质中光波长: λ= 2l/q

真空中光波长: $\lambda_0 = 2nl/q$ q是模指数



例: $l = 200 \mu \text{m}$, $\lambda_0 = 0.9 \mu \text{m}$, n = 3.6



$$q = 2nl/\lambda_0$$
 差分

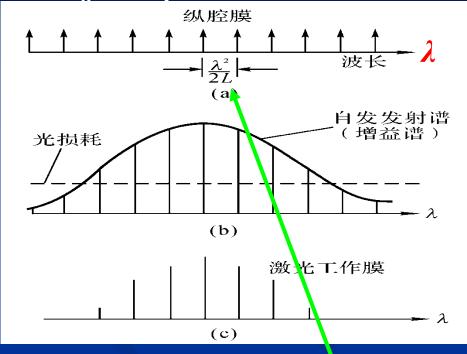
$$\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}\lambda_0} = \frac{2l}{\lambda_0^2} \left(\lambda_0 \frac{dn}{d\lambda_0} - n\right)$$

定义群速度
$$n_{e} = n \left[1 - \left(\frac{\lambda_{0}}{n} \right) \frac{\mathrm{d}n}{\mathrm{d}\lambda_{0}} \right]$$

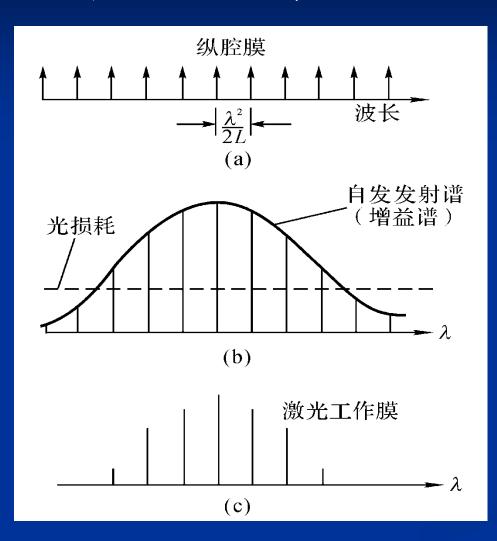
$$\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}\lambda_0} = -\frac{2n_{\mathrm{e}}l}{\lambda_0^2}$$

相邻纵模间隔dq=1

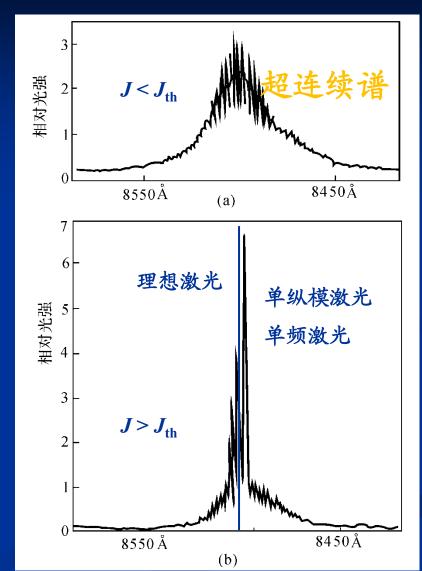
$$\Delta \lambda_0 = \frac{\lambda_0^2}{2n_{\rm e}l}$$



纵模数量与各纵模的能量都与LD的结构有关

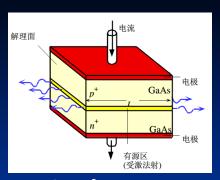


GaAs激光器的发射光谱:



5.7.3 异质结激光器

同质结激光器



没有带隙差

有源区两侧折射率差

有源区较宽

由掺杂决定

载流子扩散长度较长

折射率差很微小

简并高掺杂

对载流子限制作用弱

载流子泄漏出有源区

载流子浓度低;

增益小

载流子复合产生光子下降

对光子限制作用弱, 光子损耗大

导致阈值电流密度较大,使温度上升

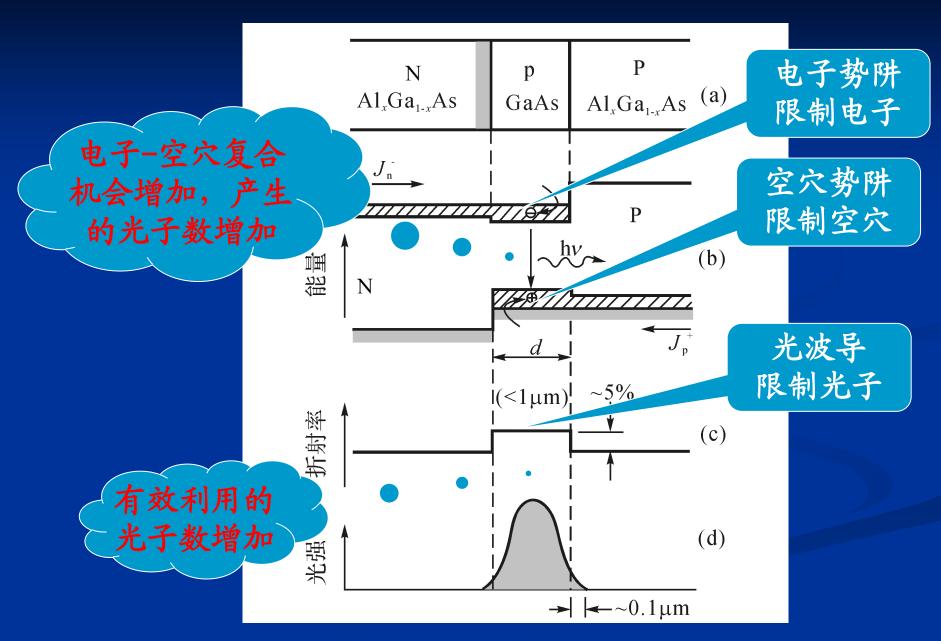
同质结激光器



阈值电流密度下降, 可以在室温下连续工作

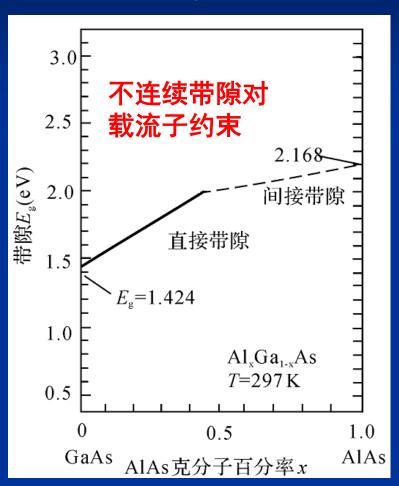
- 同质结激光器: $J_{th} \approx 4 \times 10^4 \text{ A/cm}^2$
- ・ 单异质结激光器: 有源区一侧是异质结 $J_{
 m th}pprox 8 imes 10^3\,
 m A/cm^2$
- 双异质结激光器:有源区两侧都是异质结 $J_{
 m th}pprox 1 imes 10^3\,{
 m A/cm^2}$

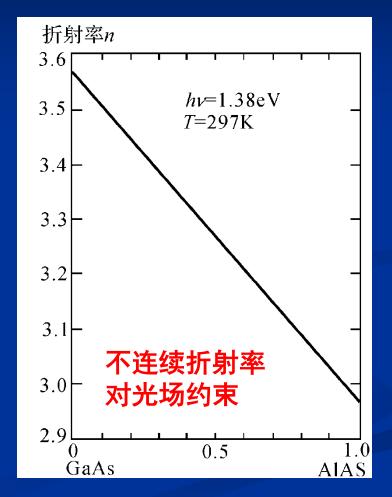
Al_xGa_{1-x}As-GaAs-Al_xGa_{1-x}As双异质结激光器



为提高辐射功率,需对载流子和辐射光产生有效约束

$Al_xGa_{1-x}As$ 的 E_g 与Al组分x 的关系





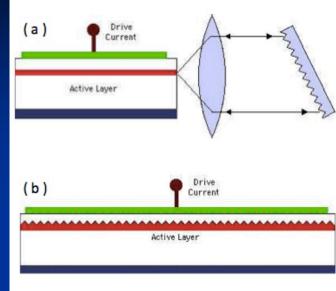
 $Al_xGa_{1-x}As$ 的n与Al组分x 的关系

5.7.4 分布反馈式(DFB) 半导体激光器

Fabry-Perot谐振腔镜面反射

一系列间隔为δλο的纵模





在有源区邻近的波导上制作周期性的波纹光栅结构 布喇格(Bragg)反射原理,同时需要满足的相位匹配条件:

$$\lambda_0 = 2n_S \Lambda/m$$
, $(m=1, 2, 3, ...$ 为衍射级)

 l_0 为真空波长, n_S 为半导体折射率

单模单频输出

$$\lambda_0 = 2n_S l/q$$

半导体激光器

布喇格光栅

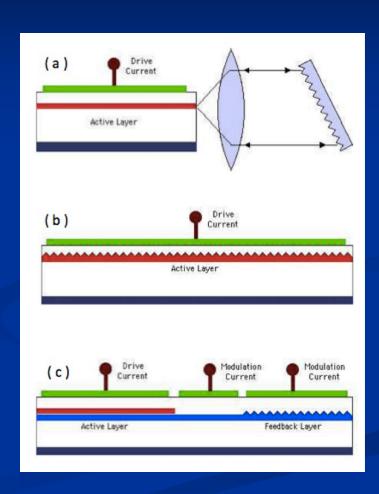
单模单频输出



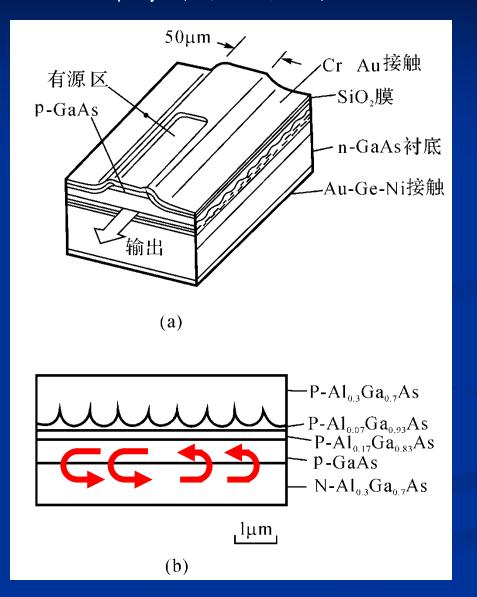
布喇格光栅移到有源区外面

分布布喇格反射(DBR)半导体激光器

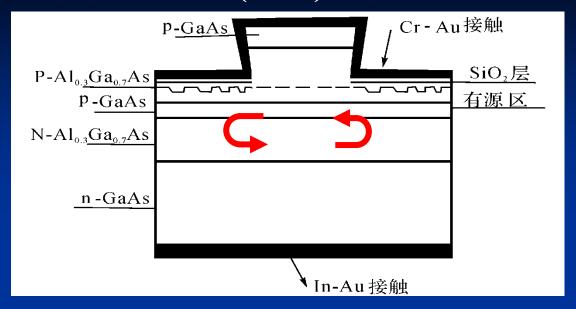
- 避免晶格损伤
- 降低损耗
- 降低阈值电流密度
- 提高发光效率



DFB (GaAs-Al_xGa_{1-x}As)双异质结 半导体激光器例:



分布布喇格反射(DBR)半导体激光器例:



- 低的阈值电流密度: 1000 A/cm²
- · 窄的谱线线宽: 0.01 nm
- 易于控制纵模
- ·不需F-P反射腔
- 有利于与其它光电子器件的耦合
- 可在同一衬底上获得多个不同波长的激光器